XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead データ間隔:1点ごとにフィッティング

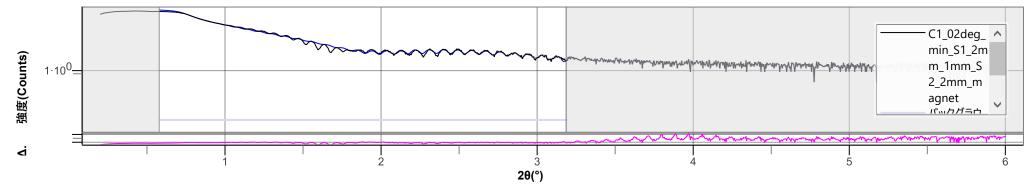
最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
\checkmark	L5	Fe2O3	1.422	Const	4.95000		0.866	Con
			±0.019	精密化	±0.06	→最大 精密化	±0.006	精密化
<u>~</u>	L4	Fe2O3	0.964	Const	2.50754	Const	1.500	Con
			±0.018	精密化	±0.03 最小←	精密化	±0.04 -	→最大精密化
\checkmark	L3	** Fe	2.392	Const	7.83910	Const	0.734	Con
			±0.3	精密化	±0.018	→最大 精密化	±0.012	精密化
✓	L2	* Fe	89.351	Const	7.16061	Const	0.100	Con
			±0.04	精密化	±0.02	→最大 精密化	±0.05最小←	精密化
\checkmark	L1	Fe Fe	3.075	Const	4.19967	Const	0.996	Con
			±0.09	精密化	±0.06 最小←	精密化	±0.03	精密化
/	基板	🖸 Si	00		2.32924	Const	0.500	Con